Antwortkarte

☐ *Ja, ich nehme an der Tagung „**Hochauflösende Oberflächenanalytik im Nanometerbereich**“ am 19. September 2007 in der Wirtschaftskammer Wien, Stubenring 8-10, 1010 Wien, teil.*

☐ *Nein, ich kann diesen Termin nicht wahrnehmen, möchte aber zu weiteren Technologietransfer Veranstaltungen eingeladen werden.*

☐ *Ich interessiere mich für Technologietransfer-Themen und möchte mehr erfahren über die Aktivitäten von*

TTZ- Leoben, Außenstelle der Austrian Research Centers GmbH - ARC und
Techkonnex - High-Tech Promotion

Bitte um Ihre Kontaktaufnahme!

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift

TECHKONNEX High-Tech Promotion

AUSTRIAN RESEARCH CENTERS

Anmeldung

Teilnahmegebühr

€ 160,- zzgl. Mwst. Im Betrag sind Seminarunterlagen, Pausengetränke und ein Mittagsimbiss enthalten.

Anmeldung

Mittels beiliegender Antwortkarte
Per Fax: 03842/46010-40
Per Mail: barbara.ebentheuer@arcs.ac.at
Online: www.arctechtransfer.at, www.techkonnex.at

Anmeldeschluss

14. September 2007. Bei Nichterscheinen und Absagen nach Anmeldeschluss wird die volle Tagungsgebühr verrechnet. Stornierungen und Absagen vor dem Anmeldeschluss werden mit einem Verwaltungsaufwand von Euro 50,- berechnet.

Auskünfte

Dipl. Ing. (FH) Margit Malatschnig
Techkonnex - High-Tech Promotion
Fleschgasse 18/3, A-1130 Wien
Tel: +43 (0)664/4225507
Mail: margit.malatschnig@techkonnex.at
Web: www.techkonnex.at

DDipl. Ing. (FH) David Moser
Technologie Transfer Zentrum (TTZ) Leoben
Außenstelle der Austrian Research Centers GmbH
Peter Tunner- Straße 27, A-8700 Leoben
Tel: +43 (0)3842/46010-22, Fax: +43 (0)3842/46010-40

Anfahrtsplan

http://portal.wko.at (Kontakt – Karte)

Allgemeines

Inhalte

- Praxisorientierte Präsentation neuester Technologien und Analyse-Verfahren
- Best-Practice Beispiele aus Industrie und Forschung
- Anschließende Möglichkeit zur Expertendiskussion

Zielgruppe

Die Veranstaltung wendet sich an Vertreter aus Wissenschaft und Industrieunternehmen aller Branchen und Größen, die sich mit den Potentialen und Möglichkeiten neuester Technologien auseinandersetzen möchten.

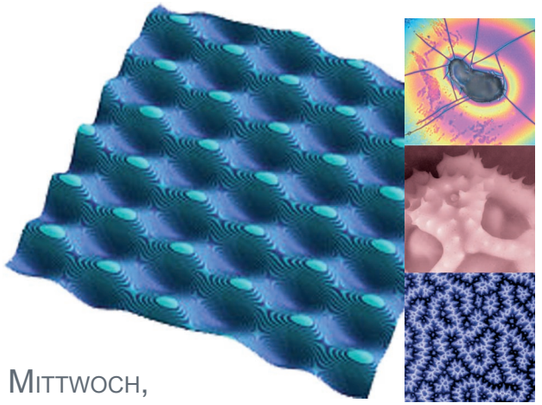
- Führungskräfte und Mitarbeiter aus Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsabteilungen
- Geschäftsführer, leitende Mitarbeiter und Fachleute aus der Produktentwicklung
- Verantwortliche aus Produktmanagement und Marketing

Mit freundlicher Unterstützung von

FRT Fries Research & Technology – Rauheit Kontur Topographie
bsw TestSystems & Consulting AG
VDI
ZEISS CARL ZEISS SMT
Veeco
HITACHI Inspire the Next
AREAM styria – inside material future

Einladung

Hochauflösende Oberflächen - Analytik im Nanometerbereich



Mittwoch,
19. September 2007
9.00 Uhr - 16.30 Uhr

Wirtschaftskammer Wien
Grosser Saal, 1. Stock
Stubenring 8-10
1010 Wien, Austria

AUSTRIAN RESEARCH CENTERS

TECHKONNEX High-Tech Promotion

Zum Seminar

Hochauflösende Oberflächen-Analytik im Nanometerbereich

Höchste Oberflächenqualitäten von Werkstoffen spielen in zahlreichen Bereichen der produzierenden Industrie, von der Automobilindustrie, dem Werkzeug- und Maschinenbau über die Elektronik- und optische Industrie bis hin zur Halbleiterfertigung und der Medizin- oder Biotechnologie eine immer größere Rolle.

Der Grund dafür liegt in permanenten Verbesserungen der Fertigungs-, Werkstoff und Oberflächentechnologien und damit verbunden steigen auch die Anforderungen in der Qualitätskontrolle: präzisere Messtechniken und vor allem auch verschiedenste Messverfahren sind erforderlich!

Damit stehen Ingenieure, Messtechniker und Entwickler, die erfolgreich und produktiv in diesem Umfeld arbeiten sollen, vor großen Herausforderungen, da sie über die neuesten Mess- und Analysetechniken informiert sein müssen.

Experten aus Industrie und Forschung berichten in der 5. Tagung aus der Reihe **„Industrial Innovation“** über unterschiedliche, modernste Oberflächenanalyseverfahren.

Der Fokus liegt auf der Präsentation neuester Messtechnik- und Analysemethoden, deren zukünftige Bedeutung für industrielle Anwendungen sowie dem Aufzeigen von neuesten Trends.

Programm Vormittag

9.00
Begrüßung, Einleitung
Dipl. Ing. (FH) Margit Malatschnig
Techkonnex - High- Tech Promotion
DDipl. Ing. (FH) David Moser
Technologie Transfer Zentrum Leoben, Außenstelle der Austrian Research Centers GmbH - ARC

9.15
Hochauflösende Oberflächenanalytik mit einem modernen Feldemissions-REM
Dr. Roland Schmidt
Hitachi High-Technology Europe GmbH, D

9.45
Anwendungen der CrossBeam Technologie für Halbleiter, Materialwissenschaften und Biotechnologie
Dr. Peter Gnauck
Carl Zeiss NTS GmbH, D

10.15 Kaffeepause

11.00
Abbildende Ellipsometrie – ortsaufgelöste Charakterisierung ultradünner Schichten
Dr. Peter H. Thiesen
Nanofilm Technologie GmbH, D

11.30
Multi-Sensor-Oberflächenmesstechnik vom Nanometer bis zum Meter
Dr. Thomas Fries
Fries Research & Technology GmbH, FRT SÜD, D

Programm Nachmittag

12.00 - 13.30 Mittagspause

13.30
Hochauflösende Rasterkraftmikroskopie an biologischen Systemen
Dr. Peter Hinterdorfer
Johannes Kepler Universität Linz, Institut Biophysik, A

14.00
AFM in industrieller Anwendung
Dr. Udo Volz
Veeco Instruments GmbH, D

14.30 Kaffeepause

15.00
„Anwendungen und Möglichkeiten der Elektronenmikroskopie in der Mikro- und Nanoanalytik“
Dr. Julian Wagner
FELMI-ZFE, Institut für Elektronenmikroskopie und Feinstrukturforschung, A

15.30
Eine neue Lösung für gepulste Strom/Spannungs Messungen bis zu 10 ns
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Norbert Bauer
bsw TestSystems und Consulting AG, D

16.00 Diskussion
16.30 Ende

Moderation: **Univ. Doz. Dr. Anton Köck**
ARC GmbH - Nano-Systemtechnologien

Absender

Name/Titel: .....
Firma/Institution: .....
Funktion/Abteilung: .....
Anschrift: .....
Tel: ..... *Fax:* .....
Email: .....

An das
Technologie Transfer Zentrum Leoben
Peter Tunner-Straße 27
A-8700 Leoben
Tel.: +43 (0)3842/460 10 Fax: +43 (0)3842/460 10-40

Bitte ausreichend frankieren!

TECHNOLOGIETRANSFER